

鋼及其滲碳層中碳的光譜分析方法^{*†}

陳 檬 丁麗君 王 琳

(第一汽車製造廠)

提 要

本文敘述鋼及滲碳鋼中碳的光譜分析方法，以及金相組織對分析結果的影響。在進行分析時，系採用 ИСП-22型水晶攝譜儀及兩種激發光源：FF-20型費氏火花光源和 ДГ-1型交流電弧發生器的高頻火花線路。單次測量百分均方誤差：費氏光源為3.75%；高頻火花為5.77%。

試驗說明：試樣中的金相組織會影響碳的工作曲線的斜率及分析結果。淬火標準試樣所制作的工作曲線的斜率比熱軋狀態標準試樣所制作的工作曲線的斜率低。淬火試樣的分析結果也比退火狀態的試樣的分析結果偏低。

一. 引 言

鋼中碳的測定，一般都採用化學分析方法，但在某些情況下，例如表面碳的測定和不破壞零件的測定，由於不能從試樣上或零件上鑽取化學試樣，所以採用光譜分析方法是比較合適的。

利用光譜分析方法進行鋼中碳的測定，已有一些文獻介紹過採用積電火花、高頻火花及低壓火花等光源的分析方法^{[1],[2],[3],[4],[5]}，也有個別文獻介紹過表面碳的分析方法^[2]。從這些文獻所介紹的方法中，可以綜合出幾個主要問題：(1)當採用中型水晶攝譜儀進行鋼中碳的分析時，由於碳線多被鈦線或其他元素譜線所干擾，因此常用的分析線只有CIII 2296.89Å，它是二次電離的離子譜線，電離位能很高，故需採用較高能量的光源，才會受到激發，常用的光源有積電火花及高頻火花；(2)由於碳線 CIII 2296.89Å 位於短波部分，所以都採用經過增感的 НИКФИ III 型光譜感光板；(3)在一些文獻中曾提到空气中二氧化碳對低含量分析的影響^[2]及鎳線 Ni II 2297.14Å 和 Ni II 2296.55Å 對碳線 CIII 2296.89Å 的干擾^{[2],[3],[4]}，由於鎳線對碳線的干擾，而使在含鎳量大於 0.8%^[2]（也有說大於 1%^[3]）的鋼種中，碳的分析方法發生了一定的困難。

我們在試驗的過程中，參考了這些文獻中所介紹的方法及特點，並結合自己的實際情況，採用 ИСП-22型水晶攝譜儀及兩種激發光源：FF-20型費氏火花光源和 ДГ-1型交流電弧發生器的高頻火花線路進行了碳的分析條件的選擇，滲碳層中碳的分布測定，並初步了解了金相組織對碳的分析結果的影響。

二. 碳的光譜分析方法

1. 分析條件的選擇

* 1959年2月28日收到。

† 此文曾在1958年11月間于北京舉行的全國光譜學會議中宣讀。

經過各項系統的試驗以後，決定採用如下的分析條件。

表 1 碳的分析條件

光 源	輸 入 电 壓	輸 出 电 壓	电 容	电 感	电 流	放 电 盘 間 隙	极 距	光 学 系 统	遮 光 板	狭 缝	預 燃	上 电 极	分 析 線 对	感 光 板 处 理 及 测 量 条 件
FF-20 火 花 光 源	220 V	12,000 V	0.019 μf	零 安培	2.6	—	1 mm	三透鏡 系統*	全 圓	0.010 mm	30"	純銅棒，直 徑 10 mm，頂端半圓形	C III 2296.89 Fe II 2311.22	NIKFI III 型光譜感光板，采用米得爾-海得路顯影液，在 19—20°C 顯影 5 分
高 頻 火 花	220 V	—	0.020 μf	—	0.5 安培	1.20 mm	0.5 mm	單透鏡 系統**	全 圓	0.010 mm	40"	純銅棒，直 徑 3 mm，頂端半圓形	C III 2296.89 Fe II 2311.22	(1) MΦ-2 光度計第三标尺("W"标尺)測量；(2)其他同上

*，** 按照儀器說明書規定的距離安裝。

在選擇分析條件時，發現下面幾種情況：

(1) 在預燃的頭 20—30 秒，線對的相對強度變化比較大，因此採用了 30—40 秒的預燃時間(圖 1 和圖 2)。

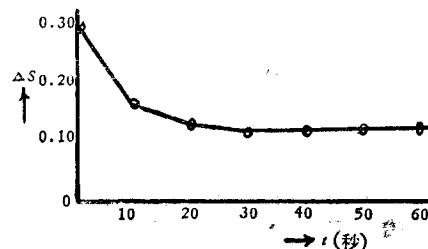


图 1 費氏光源預燃曲綫

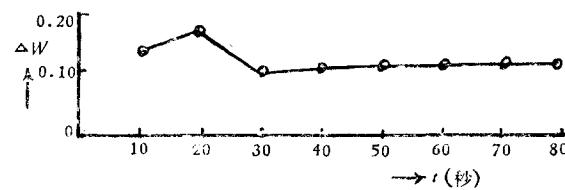


图 2 高頻火花預燃曲綫

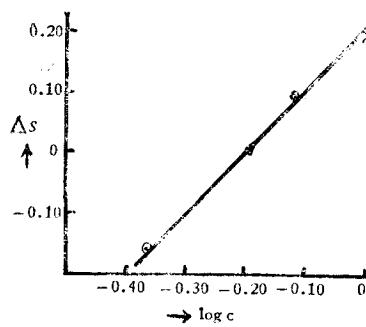


图 3 費氏火花光源工作曲綫

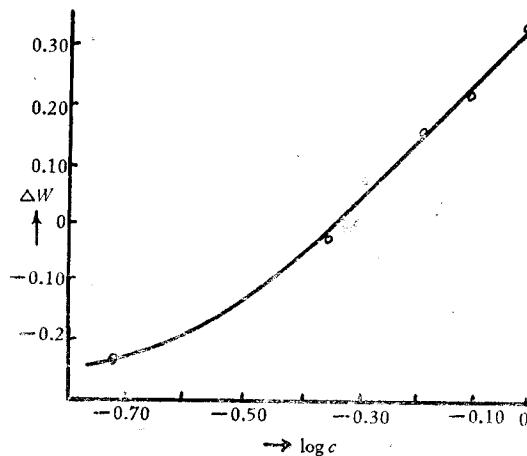


图 4 高頻火花工作曲綫

(2) 費氏火花光源的電容量增加至 0.016—0.019 微法拉時，碳線已有足夠的強度，線對的相對強度隨電容量的增加而改變也不大顯著。

(3) 曾採用純銅、純鋅和純鋁做上電極，結果以純銅做上電極的再現性和靈敏性最好。

(4) 當鋼中含鎢量大於 1% 時，碳線即受到鎢線 WII 2296.97 Å 的干擾。

(5) 高頻火花的火焰非常微弱，為了增加狹縫的照明強度，故採用單透鏡系統。

(6) 在含量低于0.2—0.3%时，工作曲线向上弯曲。

2. 工作曲线

在分析条件选定以后，采用热轧状态的标准试样制作工作曲线。工作曲线如图3和图4。

3. 分析误差统计及与化学分析的比较

分析误差的统计系采用一个含量为1.04%的试样，在同一感光板上摄谱31次，按照一般的计算方法，算出单次测量百分均方误差：费氏火花为3.65%；高频火花为5.77%。

与化学分析结果的比较如下表。

表2 费氏火花光源分析结果比较表

编 号	铜 号	C%%	C化%
1	40X	0.35	0.36
2	V _s	0.79	0.76
3	HGX15	1.03	1.05
4	V ₁₀	0.96	1.01
5		0.82	0.79
6	45	0.47	0.45
7		0.46	0.47

表3 高频火花分析结果比较表

编 号	铜 号	C%%	C化%
5	碳素钢	1.00	1.01
6007	碳素钢	0.77	0.79
45	碳素钢	0.46	0.45
26—5	碳素钢	0.52	0.47

三. 渗碳层中碳的测定

这一部分的试验是为了解决国产汽车上的一些渗碳齿轮零件的表面定碳而进行的。我厂生产的渗碳齿轮是由18XIT等牌号的钢材加工制成，再经过气体渗碳热处理。日常分析的试样是与零件相似的齿块，只要求分析表面碳的含量。故试样的加工和处理比较方便，只要将表面氧化层用砂纸擦去即可。

为了测定渗碳层中碳的分布情况，并利用渗碳层各层中不同的含碳量做标准试样，故我们在试验时采用块状的试样，试样的大小为120×40×30 mm，加工后按照齿轮渗碳工艺进行渗碳热处理，再分成数块，做为光谱分析试样，化学分析试样及制备标准试样之用。

渗碳层深度的加工方法，我们采用了阶梯式和斜面两种。阶梯式的加工方法系在试样的同一面上，按照需要深度加工数个工作平面，成为阶梯形式，然后在各个阶梯平面上进行摄谱分析。斜面加工方法系将渗碳层加工成为具有一定角度的斜坡，如图5所示。加工的角度为θ，△ABC为磨去的试样，AC是需要的工作面。设在AC面上摄谱的位置距BB'边为L，深度x=GF，则可根据要求深度，计算在AC面上摄谱的位置：

$$L = \frac{a-x}{\tan \theta} \quad \text{或} \quad L = \frac{b(a-x)}{a}.$$

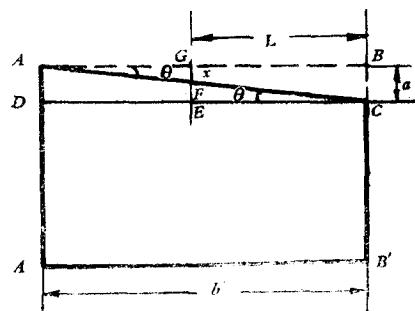


图5 斜面加工方法示意图

根据实际的体会,阶梯式加工方法較麻煩,但攝譜時比較方便,攝譜的面積可按需要加工。斜面加工方法比較方便,但攝譜的位置不好掌握,如果試樣不大,攝譜的面積还会受到限制。关于用来加工的車床或磨床,必須要求有較高的精度,加工公差不能大于±0.01 毫米,否則就会影响分析的准确度。

为了得到滲碳层各层中碳的化学分析結果,我們將一个試樣切成兩段,一段做光譜試樣进行攝譜,一段做化学試樣車取屑末。光譜試樣攝譜的深度,相当于化学試樣取样深度的平均值。例如化学試樣从 x_1 层取样至 x_2 层,其取下屑末的分析結果应相当于光譜試樣攝譜時加工深度为 Y 的分析結果,

$$Y = \frac{x_1 + x_2}{2},$$

如果考慮光譜試樣打弧斑痕深度所引入的誤差,則

$$Y = \frac{x_1 + x_2}{2} - \frac{A}{2} \quad (\text{近似值, 式中 } A \text{ 为打弧斑痕深度}).$$

下面簡單介紹滲碳层碳的分析結果,以及和化学分析比較的情况,并以百分含量为縱坐标,深度为横坐标制出碳的分布曲綫。

表 4 試樣 № 1 A 面和 B 面分析結果¹⁾

化学試樣取样深度 (mm)	光 譜 分析 深度 (mm)	費氏光源分析結果 (A 面)	高頻火花分析結果 (B 面)	化 学 分 析 結 果
	表面	0.51 ²⁾	0.44 ³⁾	—
0—0.2	0.1	0.72	0.68	0.67
0.2—0.4	0.3	0.67	0.69	0.67
0.4—0.6	0.5	0.62	0.58	0.58
0.6—0.8	0.7	0.52	0.54	0.50
0.8—1.0	0.9	0.42	0.49	0.42
1.0—1.2	1.1	0.33	0.39	0.36
1.2—1.4	1.3	0.29	0.33	0.31
1.4—1.6	1.5	0.25	0.25	0.30
1.6—1.8	1.7	0.21	0.26	0.24
1.8—2.0	1.9	0.24	0.24	0.23
2.0—2.2	2.1	0.23	0.24	0.23

1) 試樣 № 1 的热处理是不夠理想的。曾用金相檢查,均匀性不好。A 面和 B 面不一致。
2), 3) 表面滲碳层。

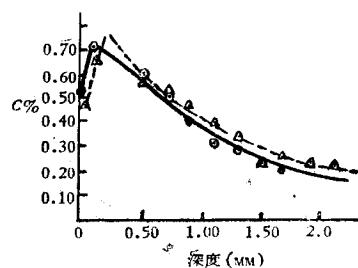
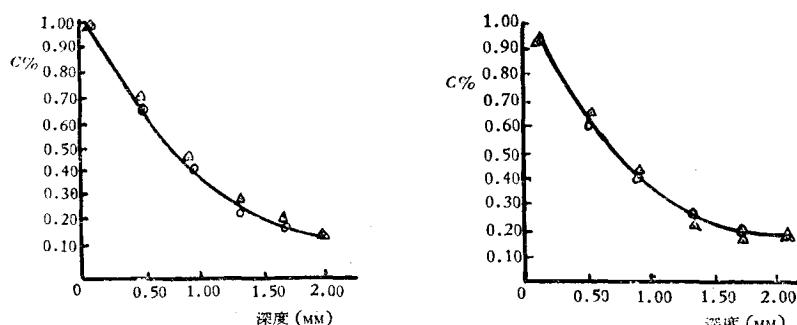


图 6 試樣 № 1 碳的分布曲綫(根据表 4 数据)
◎—A 面; △—B 面

图 7 試样№2 A 面碳的分布曲綫(数据略)
◎—光譜; △—化學图 8 試样№2 B 面碳的分布曲綫(数据略)
◎—光譜; △—化學

由于发现金相组织会影响工作曲线的斜率及分析结果，故上列的测定系采用渗碳层做标准试样和控制试样进行的。由于渗碳层各层中碳的含量变化较大，最好采用双控制试样，即采用两个不同含量的控制试样，分别控制高含量和低含量的分析。

四. 金相组织对分析结果的影响

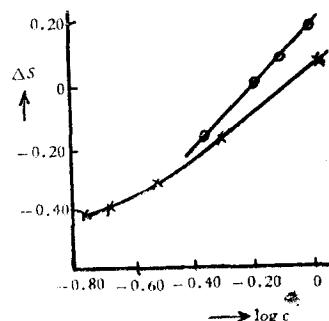
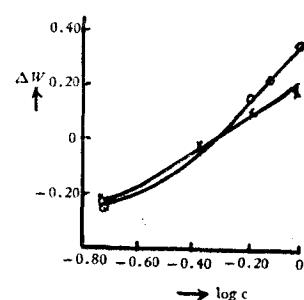
在分析钢铁中的合金元素时，由于试样中金相组织的不同，往往会使分析结果受到不同程度的影响，我们在进行钢中碳的分析时，也发现这种影响。下面所介绍的情况，主要是采用费氏火花光源进行的。

1. 金相组织对工作曲线斜率的影响

由于试样经过不同的热处理而形成不同的金相组织，会影响碳的工作曲线的斜率，经过淬火的渗碳层标准试样和原钢材（热轧状态）的标准试样所制成的工作曲线，其斜率不

表 5 金相组织对工作曲线斜率的影响

热 处 理 情 况	金 相 组 织	工 作 曲 线 斜 率	
		费 氏 光 源	高 频 火 花
原钢材：热轧状态	含碳 > 0.8% 是碳化物和珠光体 含碳 < 0.7% 是铁素体和珠光体	0.95	0.98
渗碳钢：淬火状态	表面为针状马氏体和残留奥氏体	0.70	0.77

图 9 费氏光源工作曲綫
◎—原钢材; ×—渗碳钢图 10 高频火花工作曲綫
◎—原钢材; ×—渗碳钢

一致。前者較后者的斜率低，并且在高含量时，彼此的偏離較大，低含量时，偏離較小（表 5；图 9 和图 10）。从試驗的結果看來，含量高于 0.45—0.60% 时，影响比較显著。

2. 金相組織对分析結果的影响情况

(1) 热軋状态与淬火状态試样的分析結果：

將牌号为 Y₁₀A 的碳素工具鋼一块，分成三段，进行不同的热处理，然后用費氏光源进行分析，其分析結果及热处理情况列于表 6 中。

表 6

牌 号	热 处 理 情 况	金 相 组 织	C _光 %	C _化 %
Y ₁₀ A	淬火：(在 H-30 电爐中) 在 800°C 加热 20 分，然后水淬	馬氏体+殘留奧氏体+碳化物均匀分布	0.91	1.02
Y ₁₀ A	配火：在 800°C 加热 20 分，然后气冷	配火馬氏体+碳化物均匀分布	0.91	1.02
Y ₁₀ A	原鋼材：热軋状态	球狀珠光体	1.02	1.02

为了避免由于表面脫碳的影响，又采用合金鋼 9XC 进行同样的处理，并在攝譜前将表面磨去 1—2mm。分析結果如表 7。

表 7

热 处 理 情 况	C _光 %	C _化 %
淬火状态	0.74	
配火状态	0.76	0.80
热軋状态	0.81	

由表 6 和表 7 的数据可以看出，經過淬火，以及淬火后再行低温(280°C)配火的試样，其分析結果均低于热軋状态的試样。

(2) 試样淬火后經過不同温度配火的分析結果：

試驗說明，不同温度配火的試样，其分析結果不一样，配火温度愈高，分析結果与原鋼材愈接近。

表 8 試样淬火后經過不同溫度配火的分析結果

編 号	热 处 理 情 况		金 相 组 织	C _光 %	C _化 %
	淬 火	配 火			
1	在 850°C 保溫 15 分鐘后油淬	在 200°C 保溫 1 小時氣冷	馬氏体+游离碳化物	0.81	
2		在 300°C 保溫 1 小時氣冷	+少量奧氏体	0.83	
3		在 400°C 保溫 1 小時氣冷		0.85	0.90
4		在 500°C 保溫 1 小時氣冷		0.87	
5		在 600°C 保溫 1 小時氣冷		0.89	

3. 金相組織对預燃曲綫形狀的影响

由于考慮到金相組織对分析結果的影响直接与試样的蒸发过程有关，因此我們采用一块牌号为 Y₈ 的原鋼材切成兩段。一段进行淬火，另一段保持原狀，然后觀察兩种試样的預燃曲綫的变化情况。淬火試样的金相組織為細針狀馬氏体。

試驗說明，在預燃 60 秒以前，淬火試样的預燃曲綫較原鋼材的預燃曲綫偏低，在 60 秒以后，兩者的預燃曲綫几乎趋于一致（图 11）。这說明在我們的具体情況下，增長預燃時間可以減少或消除金相組織的影響。

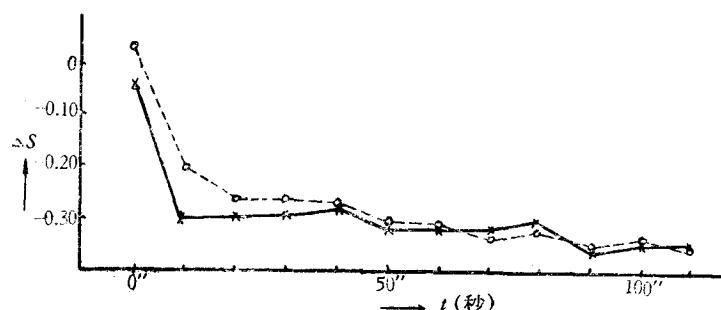


图 11 金相组织对碳的预燃曲线的影响情况

◎——原钢材；×——淬火

五. 結論和討論

1. 根据光譜分析誤差統計的結果和与化学分析結果的比較，采用上面所介紹的分析条件，尚能達到一定的准确度。利用它来进行表面碳的测定，渗碳层中碳的测定，以及不破坏零件的测定，要比化学分析方法方便，而且能解决化学分析方法所不能解决的困难。必須指出，渗碳层中碳的分析准确度与試样的均匀性很有关系，如果改进試样的均匀性，誤差会更減小的。

2. 由于金相組織对工作曲綫的斜率及分析結果会发生影响，因此必須注意标准試样及控制試样与分析試样金相組織的一致性。在分析渗碳鋼时，最好采用渗碳鋼做标准試样和控制試样。从图 11 中預燃曲綫的情况看来，延長預燃時間可以減少金相組織的影响，不过，由于我們的試驗仅限于一种牌号，热处理的情况也仅限于我們厂使用的条件，对于其他的牌号，或者存在不同第三元素时的情况如何，以及改变其他的热处理条件以后如何，还没有进一步进行試驗，因此，仍需注意这种影响。

3. 关于在低含量时工作曲綫向上弯曲的問題，我們考慮一方面是受着空气中二氧化碳的影响，另一方面，是否可以認為与光譜背景有关，因为在碳綫 CIII 2296.89 Å 附近是存在着背景的。

4. 由于条件的限制，我們的工作做得不够深入，有些問題也未进行試驗，例如对于高合金鋼及含鎳的鋼种，以及进一步探討金相組織的影响等，均未进行試驗。

本文初稿承中国科学院应用化学研究所吳欽义同志进行了审查，并提出了許多宝贵的意見，謹此致謝。

参考文献

- [1] Свентицкий, Н. С., Изв. АН СССР, сер. физ. 11 (3) (1947), 319—324.
- [2] Замятин, М. М., Гецов, А. Б. и Гринзайд, Е. Л., Зав. лаб. 21 (3) (1955), 316—320.
- [3] Борзов, В. П., Грамм, О. С., Свентицкий, Н. С. и Таганов, К. И., Изв. АН СССР, сер. физ. 14 (5) (1950), 611—617.
- [4] Олейников, А. И. и Таганов, К. И., Зав. лаб. 15 (1) (1949), 59.
- [5] Сухенко, К. А. и Яковлева, Н. П., Зав. лаб. 14 (5) (1948), 625.

СПЕКТРАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ УГЛЕРОДА В СТАЛЯХ И ЦЕМЕНТИРОВАННЫХ СЛОЯХ ЦЕМЕНТАЦИОННОЙ СТАЛИ

Чэн Бин Дин Ли-цзюнь Ван Лин
(АЗ-1, КНР)

Резюме

В настоящей статье описан метод количественного спектрального анализа углерода в стальных и цементированных слоях цементационной стали, а также описано влияние микроструктур на результаты спектрального анализа. Для определения применяется квадратный спектрограф ИСП-22 и два источника: искровой генератор Фейсснера FF-20 и высокочастотную схему генератора дуги переменного тока ДГ-1. Средняя квадратичная ошибка однократного определения равно 3.65% для искрового генератора FF-20 и 5.77% для высокочастотной искры.

Поскольку при различных условиях термической обработки в образцах может образоваться неодинаковая микроконструктура, что оказывает влияние на наклон градуировочного графика и результаты анализа. Так, градуировочные графики, построенные при помощи закаленных цементированных эталонов и эталонов из исходного материала в состоянии гречего проката имеют различные наклоны. По наклону градуировочный график, построенный при помощи закаленных цементированных эталонов меньше графика, построенного при помощи эталонов из исходного материала. Результаты анализа для образцов в закаленном состоянии различны, по результатам анализа концентрация углерода для закаленного образца ниже, чем для отожженного.